Анализ формирования сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спекл-фотографии

М.Н. Осипов¹, Р.Н. Сергеев¹

¹Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. В работе представлены теоретические и экспериментальные результаты анализа формирования сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спеклфотографии. Теоретический анализ формирования сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спекл-фотографии проведен с использованием метода Вандер Люгта. Показано, что в результате сложения смещенных в пространстве фотопластинки спекл-структур формируются муаровые полосы. Представлены экспериментальные результаты, подтверждающие теоретические исследования.

1. Введение

Спекл-фотография с двойной экспозицией - простой и универсальный метод для проведения измерений перемещений и деформаций в плоскости диффузно рассеивающих объектов [1]. Суть метода заключается в освещении шероховатой поверхности когерентным излучением при этом каждая точка поверхности, является точечным источником вторичных волн с различной фазой. За счет интерференции вторичных волн образуется субъективная спекл картина, которая связана своими характеристиками с поверхностью исследуемого объекта. Образуемая спекл картина регистрируется на одну фотопластинку в двух состояниях объекта, в не нагруженном и нагруженном. Для измерения перемещений объекта проводят когерентно-оптическую обработку фотопластинки, в результате которой смещение может быть представлено в виде картины интерференционных полос. Интерференционные полосы образуются в результате того, что каждая пара соответственных спеклов действует как пара идентичных источников когерентного света, которые образуют полосы Юнга [1-2].

Чувствительность спекл-интерферометрии к определению величины перемещения зависит от размеров спекл-структуры, которая определяется параметрами используемой оптической системы при записи субъективной спекл-структуры, т.е. числовой апертурой оптической системы [1]. Увеличение числовой апертуры оптической системы приводит к уменьшению размеров регистрируемой спекл-структуры и, следовательно, к увеличению чувствительности спекл-интерферометрии. Однако, с другой стороны, увеличение числовой апертуры оптической системы приводит к требованию использования высококачественной оптики, так как при таких параметрах начинают существенным образом сказываться аберрации оптической системы, которые приводят к искажению регистрируемой информации. Теоретические и экспериментальные исследования принципов работы оптических устройств показали, что одним из способов уменьшения среднего размера спекла является амплитудная, фазовая аподизация оптической системы [3]. В работах [4] показано, что применение кольцевых апертур в спекл-интерферометрии приводит к повышению чувствительности метода, расширению диапазона измеряемых перемещений, улучшению качества интерференционных полос при восстановлении методом Юнга, что приводит к повышению точности измерений.

Во всех ранних работах [1,2] нет полного анализа формирования сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спекл-фотографии, так как основная задача получить конечный результат – расшифровать записанную информацию.

Таким образом данная работа направлена на более детальное теоретическое и экспериментальное исследование формирования изображения в двух экспозиционной спеклфотографии и какие результаты можно дополнительно получить из этого анализа.

2. Расчёт распределения интенсивности сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спекл-фотографии

Рассмотрим образование сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спеклфотографии при диффузном отражении лазерного излучения от поверхности объекта. На фотопластинке регистрируется сумма интенсивностей света при отражении излучения от двух состояний объекта: первоначального и смещенного на величину *L* под действием нагрузки.

Оптическая схема записи сфокусированного изображения исследуемого объекта представлена на рисунке 1. Объект исследования располагается в плоскости x_1y_1 , линза и диафрагма в плоскости x_2y_2 , фотопластинка в плоскости x_3y_3 . Систему координат выбираем таким образом, чтобы смещение модели при второй экспозиции происходило только по оси *x*. Такой выбор значительно упрощает расчёт.



Рисунок 1. Оптическая схема записи сфокусированной спекл-фотографии.

Для описания прохождения волны через оптическую систему воспользуемся методом, предложенным Вандер Люгтом. С этой целью водится функция [5]:

$$\psi(x, y, p) = e^{-ikp\left(x^2 + y^2\right)},\tag{1}$$

где *x*, *y* – пространственные координаты; p = 1/d (*d* – расстояние на которое распространяется волна); $k = 2\pi/\lambda$, (λ – длина волны лазерного излучения).

Для описания прохождения волны через сферическую линзу с фокусным расстоянием f комплексную амплитуду света, падающего на линзу, нужно умножить на $\psi^*(x, y, F)$. Звездочка обозначает комплексно-сопряженную величину, F=1/f. Волна, прошедшая в пространстве расстояние d, описывается свёрткой комплексной амплитуды и выражения $i\frac{k}{2}D\psi(x, y, D)$, где $D = \frac{1}{d}$.

Применим метод Вандер Люгта для анализа записи двухэкспозиционной спекл-фотографии по оптической системе, изображенной на рисунке 1.

При первой экспозиции объект находится в ненагруженном состоянии. Диффузную поверхность можно представить состоящей из равномерно расположенных точечных источников вторичных волн одной интенсивности, но с различной фазой. Тогда отраженную от объекта волну можно записать в следующем виде [6]:

$$E_{1}(x_{1}, y_{1}) = \sum_{n=1}^{N} a e^{i\mu_{n}} \delta(x_{1} - u_{n}; y_{1} - v_{n}), \qquad (2)$$

где N – количество точечных источников; u_n , v_n - координаты n-ой точки; μ_n - фаза точечного источника; a – амплитуда точечного источника (с высокой точностью можно считать, что амплитуда точечных источников одинакова).

Распределение амплитуд на левой поверхности линзы определяется интегралом Кирхгофа-Френеля, т.е. свёрткой $E_1(x_1, y_1)$ и $i \frac{k}{2} D_1 \psi(x_1, y_1, D_1)$:

$$E_2(x_2, y_2) = i \frac{k}{2} D_1 \iint_{P_1} E_1(x_1, y_1) \psi(x_2 - x_1; y_2 - y_1; D_1) dx_1 dy_1.$$
(3)

Умножение $E_2(x_2, y_2)$ на $\psi^*(x_2, y_2, F)$, описывающую пропускание тонкой линзы, даёт распределение комплексных амплитуд на правой поверхности линзы:

$$E_3(x_2, y_2) = E_2(x_2, y_2) \psi^*(x_2; y_2; F).$$
(4)

Вычисляя свёртку $E_3(x_2, y_2)$ с функцией $i\frac{k}{2}D_2\psi(x_3 - x_2, y_3 - y_2, D_2)$ получим комплексные амплитуды в плоскости фотопластинки:

$$E_4(x_3, y_3) = i \frac{k}{2} D_2 \iint_{P_2} E_3(x_2, y_2) \psi(x_3 - x_2; y_3 - y_2; D_2) dx_2 dy_2.$$
(5)

Используя свойства функции ψ [5] выражение (5), приведем к более удобному виду:

$$E_{4}(x_{3}, y_{3}) = -\frac{k^{2}}{4} D_{1} D_{2} \sum_{n=1}^{N} a e^{i\mu_{n}} \psi(u_{n}, v_{n}, D_{1}) \psi(x_{3}, y_{3}, D_{2}) \times \\ \times \iint_{P_{1}} \psi(x_{2}; y_{2}; D_{1} - F + D_{2}) e^{ik(D_{1}u_{n} + D_{2}x_{3})x_{2}} e^{ik(D_{1}v_{n} + D_{2}y_{3})y_{2}} dx_{2} dy_{2}$$

$$(6)$$

 $E_4(x_3, y_3)$ будет являться изображением $E_1(x_1, y_1)$, если формирование изображения рассматривать в приближении геометрической оптики. Последние условие, записанное через параметры оптической системы (рисунок 1), имеет вид:

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f},\tag{7}$$

или, в наших обозначениях, $D_1 + D_2 = F$. Тогда $\psi(x_2; y_2; D_1 - F + D_2) = 1$ и уравнение (6) принимает вид:

$$E_{4}(x_{3}, y_{3}) = -\frac{k^{2}}{4} D_{1} D_{2} \sum_{n=1}^{N} a e^{i\mu_{n}} \psi(u_{n}, v_{n}, D_{1}) \psi(x_{3}, y_{3}, D_{2}) \times \\ \times \iint_{P_{1}} e^{ik(D_{1}u_{n} + D_{2}x_{3})x_{2}} e^{ik(D_{1}v_{n} + D_{2}y_{3})y_{2}} dx_{2} dy_{2}$$

$$(8)$$

Фотопластинка является квадратичным детектором, т.е. реагирует на интенсивность света, тогда распределение интенсивности света в плоскости фотопластинки запишется в следующим виде:

$$I_{0} = |E_{4}(x_{3}, y_{3})|^{2} = E_{4}(x_{3}, y_{3})E_{4}^{*}(x_{3}, y_{3}) = |A_{0}|^{2} \iint_{P_{2}} \iint_{P_{2}} e^{ikD_{2}x_{3}(x_{2}-x_{2}')}e^{ikD_{1}(u_{n}x_{2}-u_{m}x_{2}')} \times e^{ikD_{2}y_{3}(y_{2}-y_{2}')}e^{ikD_{1}(v_{n}y_{2}-v_{m}y_{2}')}dx_{2}dy_{2}dx_{2}dy_{$$

Во время второй экспозиции пусть отражающая поверхность объекта смещается на величину *L*. Как было выше сказано, систему координат располагаем так, чтобы перемещение происходило только по координате *X*. В таком случае отраженная волна принимает вид:

$$E_{1L}(x_1, y_1) = \sum_{n=1}^{N} a e^{i\mu_n} \delta(x_1 - u_n - L; y_1 - v_n),$$
(10)

Вычисляя аналогично прохождение сигнала через оптическую систему, получим распределение амплитуд в плоскости фотопластинки при смещении объекта в следующем виде:

$$E_{4L}(x_3, y_3) = -\frac{k^2}{4} D_1 D_2 \sum_{n=1}^N a e^{i\mu_n} \psi(u_n + L, v_n, D_1) \psi(x_3, y_3, D_2) \times \\ \times \iint_{P_1} e^{ik(D_1(u_n + L) + D_2 x_3) x_2} e^{ik(D_1 v_n + D_2 y_3) y_2} dx_2 dy_2$$
(11)

Тогда интенсивность примет вид:

$$I_{L} = \left| E_{4L}(x_{3}, y_{3}) \right|^{2} = E_{4L}(x_{3}, y_{3}) E_{4L}^{*}(x_{3}, y_{3}) =$$

$$= \left| A_{L} \right|^{2} \iint_{P_{2}} \iint_{P_{2}'} e^{ik(D_{1}L + D_{2}x_{3})(x_{2} - x_{2}')} e^{ikD_{1}(u_{n}x_{2} - u_{m}x_{2}')} \times,$$

$$\times e^{ikD_{2}y_{3}(y_{2} - y_{2}')} e^{ikD_{1}(v_{n}y_{2} - v_{m}y_{2}')} dx_{2}dy_{2}dx$$

где
$$|A_L|^2 = \left(\frac{k}{2}D_1D_2\right)^2 \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N a^2 e^{i(\mu_n - \mu_m)} \psi(u_n + L, v_n, D_1) \psi^*(u_m + L, v_m, D_1).$$

Коэффициенты $|A_0|^2$ и $|A_L|^2$ отличаются на бесконечно малую величину за счёт того, что

структура поверхности существенно не меняется. Поэтому можно считать, что $|A_0|^2 \approx |A_L|^2$.

Полученные две спекл-картины при не нагруженном и нагруженном состоянии сдвинуты на *L* в пространстве изображения и при наложении друг на друга представляют собой сложную дифракционную решётку, которая несёт информацию об изменениях, происшедших с поверхностью объекта.

Так как интенсивности света при двух экспозициях регистрируются на одну фотопластинку, то суммарная интенсивность будет иметь вид:

$$I = I_{0} + I_{L} = |A_{0}|^{2} \iint_{P_{2}} \iint_{P'_{2}} \left\{ e^{ik(D_{1}L + D_{2}x_{3})(x_{2} - x'_{2})} + e^{ikD_{2}x_{3}(x_{2} - x'_{2})} \right\} e^{ikD_{1}(u_{n}x_{2} - u_{m}x'_{2})} \times e^{ikD_{2}y_{3}(y_{2} - y'_{2})} e^{ikD_{1}(v_{n}y_{2} - v_{m}y'_{2})} dx_{2}dy_{2}dx'_{2}dy'_{2}$$

$$(13)$$

Упрощая сумму в фигурных скобках, получим:

$$I = I_0 + I_L = |A_0|^2 \iint_{P_2} \iint_{P'_2} e^{ikD_2x_3(x_2 - x'_2)} e^{ikD_1(u_nx_2 - u_mx'_2)} \times e^{ikD_2y_3(y_2 - y'_2)} e^{ikD_1(v_ny_2 - v_my'_2)} \cos\left(\frac{k}{2}D_1L(x_2 - x'_2)\right) dx_2 dy_2 dx'_2 dy'_2$$
(14)

Как показано в работах [1,2], подынтегральное выражение описывает размер спеклов, которые зависят от вида используемой апертуры на входе оптической системы. Также из выражения (14) следует, что суммарная интенсивность промодулирована функцией косинус. Модуляция интенсивности в плоскости фотопластинки можно охарактеризовать как образование муаровых полос. Данные муаровые полосы образованы за счет, как следует из теоретических расчетов, геометрического сложения сложных непериодических спекл-структур.

3. Экспериментальное наблюдение муаровых полос

На основе оптической схемы, представленной на рисунке 1, был проведен эксперимент с двухэкспозиционной записью сфокусированных спекл-фотографий. В качестве исследуемого объекта выступал диффузно рассеивающий круглый плоский диск, совершающий поворот вокруг центра на малую угловую величину. Использовался стандартный объектив КАЛЕЙНАР-3Б 2,8/150. Увеличение оптической системы равнялось 1. Источником когерентного освещения служил лазер с длиной волны лазера 532 нм. Для записи сфокусированных спекл-структур использовались фотопластинки ВРП-М.

Для наблюдения муаровых полос двухэкспозиционная фотопластинка освещалась источником белого света. Полученные характерные фотографии муаровых полос показаны на рисунке 2.



Рисунок 2. Фотография муаровых полос в белом свете под разными углами наблюдения.

Из анализа фотографий видно, что частота муаровых полос меняется в зависимости от удаления от центра вращения диска. Это соответствует ходу эксперимента – смещение увеличивается вдоль радиусу вращающегося диска.

Наблюдаемые муаровые полосы позволяют без дополнительных экспериментов и расчетов оценить распределение перемещений в плоскости исследуемого объекта.

4. Заключение

В работе с использованием метода Вандер Люгта проведен теоретический анализ формирования сфокусированного изображения в двухэкспозиционной спекл-фотографии и показано образование муаровых полос, которые позволяют без дополнительных экспериментов и расчетов оценить распределение перемещений в плоскости исследуемого объекта. Проведенные экспериментальные исследования подтверждают теоретические расчеты.

5. Благодарности

Исследования были проведены при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 19-01-00631 и №19-31-90100.

6. Литература

- [1] Клименко, И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл-интерферометрия М.: Наука, 1985. 224 с.
- [2] Yamaguchi, I. Fringe formation in speckle photography // J. Opt. Soc. Am. A. 1984. Vol. 1(1). – P. 81-86.
- [3] Хонина, С.Н. Фазовая аподизация изображающей системы с целью увеличения глубины фокуса в когерентном и некогерентном случаях // Компьютерная оптика. – 2012. – Т. 36, № 3. – С. 357-364.
- [4] Osipov, M.N. Digital speckle photography with the ring aperture diaphragm / M.N. Osipov, R.N. Sergeev // Procedia Engineering. 2017. Vol. 201. P. 155-163.
- [5] Vander Lugt, A. Operational notation for the analysis and synthesis of optical data-processing systems //Proc. IEEE. 1966. Vol. 54. P. 1055-1063.
- [6] Goldfischer, L.I. Autocorrelation function and power spectral density of laser-produced speckle patterns // J. Opt. Soc. Am. 1965. Vol. 55(3). P. 247-253.

Analysis of focused image formation in double-exposure speckle photography

M.N. Osipov¹, R.N. Sergeev¹

¹Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34A, Samara, Russia, 443086

Abstract. The paper presents theoretical and experimental results of analysing the formation of a focused image in double-exposure speckle photography. A theoretical analysis of the formation of a focused image in double-exposure speckle photography was performed using the Vander Lugt method. It is shown that moiré fringes are formed as a result of the summation of speckle structures displaced in the space of the photographic plate. Experimental results confirming theoretical research are presented.